PΙ NL 7508684 19760202 (197607)* 19760212 (197608) DE 2533455 A DK 7503410 19760412 (197620) A JP 51037819 FR 2280585 A 19760330 (197620) 19760402 (197621) Α PRAI US 1974-492807 19740729

IC B01J017-40; C01B033-02; C22B061-00 AB NL 7508684 A UPAB: 19930901

NL 7508684 A UPAB: 19930901 In the continuous prepn. of silicon for semiconductors by passing a decomposable gaseous source of silicon into a reaction chamber in which it is decomposed and precipitates silicon, the gaseous source particularly trichlorosilane is brought into contact with rods in the reaction chamber heated to a temp. of >=1415 degrees C, so that the precipitated silicon in the liq. state drips downwards and is collected in the reaction chamber. Very much higher production rates can be achieved which do not vary with time since there is no change in the mean diameter of the rods as is the case when the silicon is deposited as solid.



優 アメリカ合衆四 1974年 7月29日第 492807 原頂(A)(特許法第38条ただし書) の規定による特許出願)

圖

月 25 日

特别小長官

ソーレンクテナロングが対対は ソウチ素の連続的製造方法及び装置 1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲に記載された発明の数 🔹

明者

住 所

アメリカ合衆国アリゾナ州 850/8 3111 ピルヤイング

胚 务

4. 特許出願人

シカゴ 40431 u - F 5725

・インコーポレーテフトを持力に

50, 7, 28 识别少 注

廽

〒100 東京都千代田区護が関3丁目2番4号 裁山ビルディング7階 電話 (581) 2241番 (代表)

秀四节

(12か1名) 苗穂

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-37819

43公開日 昭51. (1976) 3.30

②特願昭 *50-91497*

昭50 (1975) 1. まち 22出願日

未請求

(全5頁)

庁内整理番号 7/28 42 7047 42 6521 57 7128 42

6616 42

52日本分類 10 R321 99(4)AO 10 A21 13(7)D63 13 A26

51) Int. C12. COIB 33 02

HOIL 21 02 C23C 17:00

建 蒸 の 違 統 的 製 造 方 法 及 び 装 電 1. 発明の名称 ュ 特許 静求の 範囲

- 珪素を連続的に製造するにあたり、 反応室 内の維積器を少くとも / ₹/5℃ 以上の温度に 加急する段階と登場の対象可能なガス状輪源を前 配反応室に選してこのガス状給源を分解し地 職俸上に韭菜を液体状で堆積する段階と、前 記波体状珪素を反応室底部内に捕集する段階 とを有することを特徴とする珪葉の連続的製 **造方法。**
- 2 珪素の連続的製造装置において、反応室と、 前記反応室内に配置した複数個の円筒状堆積 俸と、前記堆積棒を珪素の融点以上に加熱す る装置と、前記反応室内に配置されて液体状 の前記珪葉を捕集する装置とを具えることを 特徴とする造業の連続的製造裝置。

3 発明の静細な説明

本発明は珪素、特に半導体用珪素の製造方法 及び装置に関するものである。

健子工衆では珪素を半導体物質として使用する ことは広く行なわれている。半導体物質の珪素を 工業的に多量製造する方法は多数開発されている。 これ 等の方法は高純度の珪素体を出発元素として 使用するのが通常である。この出発物質上に、分 解可飽な珪素化合物から蒸気相から維馥により、 同等高純度の建業を生長させる。建業化合物の分 解は高温で生ずる為この出発珪素元素上に珪素の 生長を生じさせる為には、この珪素元素を普通隠 気的加熱により分解温度に加熱しなければならな い。然し高朝度の珪葉は常温で奢しく商い毎気纸 抗を示す。幸いなことに、この高い電気抵抗は盈 度の上昇に伴ない迅速に減少する。 かくて、 補助 ニネルギー源を最初用いて高抵抗珪素体を常温が 5 所定高温(建築体が通常の電流に対し十分に 夢 世色であつて珪素体を所定分解温度に維持する温 度)まで加機する必要があることが見出されてい る。次いて、分解可能な造業化合物を反応室に選 し、建設を建築体上に生長させる。

他の楚葉堆覆方法においては、タングステン又

特閱 昭51—37819(2)

・はチタン等の金属フィラメントを強蔑部材として 用いる。前述の方法と同様に、この金属フィラメ ントを通常約 / / 00℃ の堆積温度に加熱し、分解 可能な珪素化合物から成る輪源を反応室内に通し て分解させる。適当量の多結晶珪素の堆積に続い て、堆積棒を反応室から取出し、これからフィラ メントをドリル又は食剤により取外す。

本発明の/目的は、珪素を新規な様式で製造する方法を得るにある。

本 発明の他の目的は、半導体用金に適当を 母素の実用的且つ経済的製造方法を得るにある。

本発明のさらに他の目的は、半導体用途に避当な珪素の連続的製造方法を得るにある。

本発明のさらに他の目的は、液体状態素を連続的に製造する方法及び装置を得るにある。

本発明のさらに他の目的は、堆積した珪素が液体状であり、連続的基準で捕集されるまで液体状に維持される方法及び装置を得るにある。

本発明のさらに他の目的は、珪素の酸点以上の温度に維持される鎌上に、分解可能な珪素結准から硅素を堆積するにある。

前述の籍目的に従つて本発明は、複数偶の年相様を収容する反応室を用い、珪素を連続的に製造する方法及び装置を提供する。各には珪紫の融点/4/3で以上に加熱する。分解可能な珪素給源は反応室に通し、融無した形状の珪素は矮上に捕集した後重力により反応室底部に滴状で著下させ捕

· 集 す る 。

本発明は強複像を注葉の融点(約 / */5℃)以上の温度に維持することに特色がある。 注菜はガス状治液からなおも分解するが液体状にとどまり、塩糠経上で固体として捕集されるよりは維強体から離れて下方に流下する。 //00℃又は / 4/5℃で塩潤した注葉の平衡 8 の差は、機分無視するこ

とができる。実際、 1413℃ では値かに多盤の珠 業が推復する。然し、温度がさらに増大すると、 **建業が拡散によりガス状形線に戻りガス状態気中** の他成分と再結合する為、実際には反応が逆方向 となり得る。反応速度の一そう大きな増大は、ガ ス状原子の拡散通路長さを減少することにより得 るととができる。との拡散通路長さの減少は、単 機律の客職を空隙空間に比べて大とすることによ り得ることができる。明らかに堆積糠客様を空隙 空間に対して増大するととは、堆積する珪素を受 取る為に利用可能な様の比例的要面積をも増大す る。塩種種の表面機は、単にノ本の塩産体の容易 を潜大するよりも、比較的小さい維護器を多数用 いることにより、著しく増大する。また、塩焙塩 が建築の融点以上の温度に維持されて建築が液体 状で魚力により埠殻部から流下して頒祭されるに、 反応国内の福港部の雰面理は比較的一定に留まり、 処理工程はパッチ操作よりも連続操作となる。

本発明を次に図面につきさらに詳細に散動する。 第一図において、反応窒/0 は本発明により液体

特開 昭51-37819(3)

・状で建業を連続的に堆積する。反応室// は黙々簡 状の側壁// と、基底部材// と、頂部蛮// とを具え る。側壁// は比較的厚い絶縁 被覆// により取囲まれている。反応室// 内には頂部蚕// により支持される多数の堆積準// を配置する。堆積準/3 は基部 強// 直接を重視したの下端は反応室// の基底部 // の値かに上方で終っている。裏張// (これは予 りを通した固体状建業でも整支えない)を反応室 // の基底部// に設けて、液体状理素// の補集を便 たりしめることができる。

。 1964年1月1日 - 1

> 婚子/8を介して電力供給線を堆積棒/5に接続し、 ガス状珪素給減を反応室/8内に送入管/9から送入 する。反応窓から過剰ガスを除去する排出管は図 面中では省略してある。

従来技術においては、 68.58 cm (カインチ) の 内径を有する代表的反応室内で、平均して 560 9/h の建業を 260 時間に亘つて超破する。 かく て堆積速度は 0.3/ 9/h/ 平方インチである。然し 操作の終期には、建業直径が約 /0.2 cm 以上にな ると堆積速度は 1/06 9/h となり、平均的建業権*

被盗度 5 6 0 9/h の約 2 倍となる。かくて仮りに本発明に従つて、 / 本の直径約 /0.2 cm の堆積棒を建業融点以上の温度に維持すれば、この //06 9/h の堆積盗皮と同じ約 //00 9/h の堆積盗皮を連続的に維持することができる。

第 2 図は 700 本以上もの堆積様 /3 を収容する反応室 /0 の所面を示し、大妻面積の形成と平均長さの小さい拡散通路とを示す。各堆積様 /3 は第 3 図に示すように円筒 20 であることが好ましく、 石英管 2 により被覆された高密度のグラファイトであ

・ることが好ましい。即ちグラファイトは石英を強っ 化し、石英は炭素が珪素を汚染しないようにする。 円筒状グラファイトがには撃孔22及び23を設けて 加熱フィラメント38を第子はに接続し電気エネル とのフィラメント38を第子はに接続し電気エネル ギー液から電力の供給を受けるようにする。

本発明のさらに他の / 例においては、第4 図に示すように堆積標 / 3 を は円筒状 グラファイト かると破 屋石英 かっとを 具える。 円筒状 グラファイト かっ 及び その内部を 賃還する 穿孔 かの 両端には 夢電板 か及び みを 設け、 円筒状 グラファイト かっ の 両端を 溥 電線 で接続する。 との形式の 堆積 様においては、 円筒 状 グラファイトを 被 環石 英の 抵抗 加 熱 器 として 用いる。

第 5 図は建業製造時における汚染の一そう少ない 地稜様を示す。 との堆殻線パッ は全体が建築から成り、 内部を変遷する 李孔 30 を通し堆積傷パッの両婦に導電線を接続することができる。 建業様 自体は 電気抵抗が常温では 高い が高温では 低い 為、 地 機 密 表面上の液体状性素 の被膜は 導電通路を形 **

成して堆積棒パbを抵抗加熱し、一方堆積銀パbの 内部は充分た断熱性を有する為堆積棒姿面が維持 される建素酸点より低温に維持される。かくて造 素棒は姿面が酸点温度にあつてもその物理的連続 性を保持する。

生素堆積棒の内部が超突にその物理的一体性を維持するように、第4図に示す堆積 15°を用いると対すると、類選を材料として、数を積 15°の内部を質 15°である。と、数でである。をできる。をできる。の内部を質 15°での中心が強 25°である。の中心が強 25°である。一方との時 準 接 変 面は 14/5°で又は 2 に 4 を 5 で 5 温に 25°である。

競作にあたつては、塩酸溶けを約 / 4/3℃に加 熱し、10 5 のトリクロルシランと水変との混合物 を送入管 19 から導入する。 高退の塩酸器とトリク ロルシランが接触すると、トリクロルシランは発 音、水素及び塩素に分解する。 箱廻した浸露は液

特開昭51-37819(4) RF 加融を用いることもできる。また、中空機設 準の内方に塩穣させることもできる。

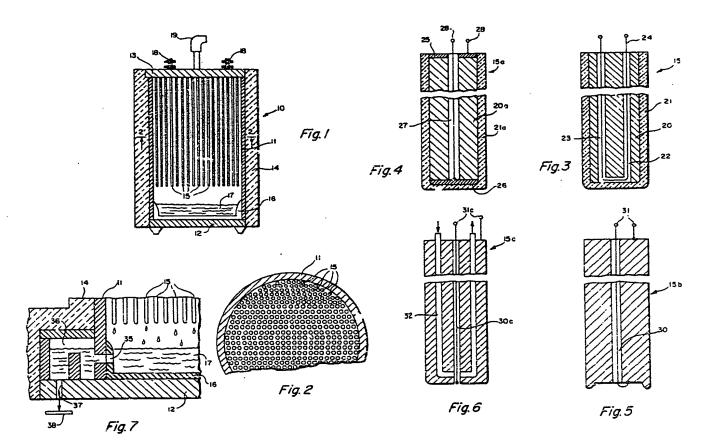
《図面の簡単な説明

第/図は本発明により珪素を連続的に製造する為の反応室を示す線図的新面図、第2図はその2-2線上の断面図、第3図は本発明に保る堆積棒の線図的新面図、第4~4図は本発明に係る堆積棒の他の例を示す線図的断面図、第7図は反応室の融解珪素を捕集する部分の線図的断面図である。

10 … 反応室、11 … 反応室 10 の 値壁、12 … 反応室 10 の 善底部、13 … 頂部壺、14 … 絶縁 被覆、15 ,13 a 15 b ,15 a … 堆 後俸、16 … 裏優、17 … 液体状 珪葉、18 … 端子、19 … 送入管、20 。20 a … 円 簡状 グラファイト、20 ,20 a … 被 覆石 英管、22 ,23 … 穿孔、25 … 加熱フィラメント、25 ,26 … 導 包 板、20 … 穿孔、25 … 適子、30 。30 。 穿孔、31 ,30 。 端子、32 … 增 条 部材。

かくて明らかたように本発明に使れば、ガス状 粉顔物にトリクロルシランから造業を連続的に製 造する方法及び装置が得られる。然し、四塩化珪 楽又はその他のヘロゲン化珪素も用いるととがで まる。

本発明を好適な実施例につき説明したが、本発明の広汎な精神と視野を逸脱することなく程々の 変更及び修整を為し得ること勿論である。例えば、



特開 昭51-37819(5)

6. 添附書類の目録

(1) 劈

1 通 (原本及訳文)

(5) 優先格証明書 1 通(原本及訳文)

(6) 国籍並洪人証明会 1 3 (原本度)文)

7. 前記以外の発明者,特許出願人または代理人

(t) 発明者

アメリカ合衆国アリゾナ州 88283 住 所 F947 6305

マルコム・ジョセフ・ルス

(2) 代理人

〒100 東京都千代田区蔵が関3丁目2番4号 · 唐 器山ビルデイング7階 電話(581)2241番(代表)

村 弁理士 杉

